66000

高濃度ホウ素ドープダイヤモンド超伝導体の軟 X 線 角度分解光電子分光

横谷尚睦 岡山大学大学院自然科学研究科 〒700-8530 岡山市津島中 3-1-1

要 旨 高濃度ホウ素ドープダイヤモンド超伝導体の占有電子状態を SPring-8 BL25SU の軟 X 線角度分解光電子分光 を用いて研究した。ダイヤモンド超伝導体の価電子帯電子構造が純粋なダイヤモンドのものと一致すること、ホウ素濃度 の増加に伴いダイヤモンド価電子帯の頂上にホールが導入されていくことを直接的に観測した。これらの結果は、高濃度 ホウ素ドープダイヤモンドの超伝導機構解明に重要な指針を与えるとともに、軟 X 線角度分解光電子分光が新規機能性 物質の電子状態研究に対して強力な手法であることも示している。

1. はじめに

宝石として知られるダイヤモンドは、最も硬い物質であ ると同時に、高い熱伝導率や大きなバンドギャップを持つ 半導体である。微量に不純物をドープした半導体の伝導特 性は、固体のエネルギーバンドおよびドープによりバンド ギャップ中に形成された不純物準位によってよく理解され ている¹⁾。また、ドープしたシリコンなどの試料を用いた 研究からは、金属-絶縁体転位が不純物バンドにおいて起 こることが報告されている²⁾。しかしながら、より高濃度 に不純物をドープした半導体の電子状態についてはよく理 解されていなかった。このような状況の中、2004年に高 濃度ホウ素ドープダイヤモンドの超伝導性が発見され³⁾、 その再現性が確認されると^{4,5)}、金属的伝導を担う電子構 造の起源を実験的に明らかにすることが重要な課題となっ た。というのは、フェルミ準位(*E*_F)近傍の電子状態の 起源に依存して異なる超伝導機構のモデルが提案されたか らである。

ダイヤモンド結晶は、炭素原子の sp³ 混成軌道からなる 3 次元共有結合ネットワークから成り立っている(Fig. 1)。 電子構造は、幅の広い3本のバンドからなる。バンドギ ャップは間接型[ブリルアンゾーンΓ点に価電子帯頂点、 Γ点とX点の間(Δ線上)に伝導体の底を持つ(Fig. 2参 照)]であり、その大きさは5.5 eVである。微量にホウ素 をドープした場合には、ホウ素原子は炭素原子を置換し、 価電子帯の頂上から0.37 eV に不純物準位を形成すること が知られている⁶⁾。ホウ素のドープ量が増加すると、不純 物準位のキャリアーの波動関数が重なり、不純物準位が不



Fig. 1 Conventional cubic cell of the diamond lattice.



Fig. 2 3-dimensional Brillouin zone (BZ) of diamond (inset) and its intersection, together with soft X-ray angle-resolved photoemission spectroscopy (SXARPES) intensity map (blue scale) and measured momentum positions (red curve).

純物バンドへと変化してゆく。幅の狭いバンド上のキャリ アーは、少ないキャリアー濃度による低い遮蔽効果のため 強いクーロン力を感じる。ダイヤモンド超伝導体において 不純物バンド中の強相関キャリアーが金属的伝導を担う可 能性が指摘され、拡張 s-波超伝導の予測がなされた⁷⁾。電 気伝導性に対する局在状態からのアプローチである。一 方、遍歴状態からのアプローチは、ホウ素ドープによる電 子数の減少はダイヤモンド価電子帯頂上にホールポケット を形成すると予測する。この場合には、超伝導は Γ 点に 導入されたホールと高いデバイ温度を持つフォノンとの結 合によりもたらされる⁸⁾。 $E_{\rm F}$ 近傍の電子状態を実験的に 決めることが超伝導の起源を知る上で重要な役割を果たす ことになる。

2. 実験

2.1 ダイヤモンド薄膜

本研究に用いた試料は、マイクロ波プラズマ化学気相合 成法 (CVD) で作製した(111) 配向のホモエピタキシャル 薄膜である9)。ホウ素ドープ量を系統的に変化させた3個 の試料に対して測定を行った。二次イオン質量分析法 (SIMS) により求めたホウ素ドープ量 (n_{B SIMS}) と電気 抵抗または磁化測定から求めた超伝導転位温度(それぞれ $T_{c, res}$, $T_{c, mag}$ とする)をTable 1に示す。ホウ素ドープダ イヤモンド試料では、 $T_{c, res}$ は $T_{c, mag}$ より高く、電気抵抗 0を示す温度が、T_{c.mag}に対応する。ホウ素ドープダイヤ モンドにおける超伝導性は、高温高圧合成で作られたバル ク試料で発見された³⁾。しかし,高温高圧合成では,大き な単結晶を得ることおよびホウ素ドープ量を系統的に変化 させることは難しい。それに比較して、ホモエピタキシャ ル薄膜では、系統的にホウ素濃度を変化させた大表面積 (2×2 mm²)の単結晶を得ることができる⁹⁾。加えて、ホ モエピタキシャル薄膜試料の表面は非常に安定である。こ れらの特徴は、今回の角度分解光電子分光測定の成功に重 要な役割を果たした。

2.2 軟 X 線角度分解光電子分光

角度分解光電子分光は,光電効果を利用して運動量k に分解した物質の電子状態を測定できる手法である。真空 紫外光を使った角度分解光電子分光では,エネルギーおよ び運動量分解能の飛躍的な向上により,物性と一対一に対

	Sample 1	Sample 2	Sample 3
$n_{BSIMS}~(cm^{-3})$	$2.89 imes 10^{20}$	$1.18 imes 10^{21}$	$8.37 imes 10^{21}$
$T_{c,res}$ or $T_{c,mag}$	Non super below 1.7 K	$\rm T_{c,res}{\sim}2\rm K$	$T_{c, mag} = 7.0 K$

応した電子状態を直接観測することができるまでになって いる。一方,軟X線を使った場合には,分解能は劣るも のの,よりバルク敏感な電子状態をプリルアンゾーン全体 にわたって測定することができる¹⁰⁾。この利点は,新し く発見された物質の電子状態研究に対しては特に重要であ る。

ダイヤモンド超伝導体の場合には, CVD 薄膜表面が水 素終端されているため,固体本来の電子状態を高い信頼性 で観測するためにはより光電子の脱出深さの深い軟 X 線 が必要であったと考えている。加えて,軟 X 線を使うこ とにより,比較的大きなダイヤモンドのブリルアンゾーン 全体にわたるバンド分散を一回の角度同時測定で観測する ことができた。この点は,超伝導性が,明らかにホウ素 ドープダイヤモンドに起因していることを確定するのに極 めて重要な役割を果たしたと考えている。

実験は SPring-8 の BL25SU の光電子分光装置を用いて 行った。エネルギー分解能および角度分解能は825 eV の 光エネルギーに対して250 meV と±0.1度に設定した。測 定温度は20 K,測定時の真空度は 3×10⁻⁸ Pa であった。 試料は、ラウエ写真で結晶方位を決め、それに従い試料ホ ルダーにマウントした。ブリルアンゾーン中の測定面(線) は Fig. 2 に示されており、それは 3 次元ブリルアンゾーン (挿入図)の水色の面に対応する。清浄試料表面は超高真 空下において400度 C 以上に試料を加熱することで得た。

3. 実験結果および考察

測定に先立って、光エネルギー依存角度分解光電子測定 を光エネルギー770 eV から870 eV まで行い,得られたス ペクトルの E_F 上の強度を終状態自由電子モデルを用いブ リルアンゾーンにマッピングした(Fig. 2)。光電子強度分 布が**Γ**点付近で最大値を持つことがわかる。この結果 は,バンド計算でダイヤモンドの価電子帯がΓ点に頂点 を持つことと一致する。Γ点に対応する光エネルギーを見 積もった上で,ブリルアンゾーン **FKLUX** 面内の赤線に 沿って825 eV の光エネルギーで測定を行った。Fig. 3a, b は、高濃度ホウ素ドープダイヤモンド薄膜試料(試料1, 2)の価電子帯全体にわたる光電子強度分布である。縦軸 が結合エネルギーで横軸が表面に水平方向の運動量成分で ある。高強度を結んだ曲線がバンドに対応する。Fig. 3a に おいて,7本のバンドが観測され,それらに1-7の番号を 対応させた。15 eV より低結合エネルギー側には、4 本の バンド分散がはっきりと観測される。バンド4は、低運 動量側でバンド3と重なる。強度の弱いバンド5も観測 される (Fig. 3b ではよりはっきりと観測されている)。15 eVより高結合エネルギー側には、バンド6と7が観測さ れるが、これらは Γ 点で底を持つ双曲線的な分散の一部 分であると考えられる。測定の運動量範囲内でバンド7 は運動量1.5 Å-1 付近で頂点を持ち,ゾーン境界(Fig. 2



Fig. 3 Experimentally determined valence band dispersions and BZ of diamond. a and b, valence band SXARPES intensity maps from single crystal diamond (111) films (sample 1 and 2) using 825 eV photon energy along the red curve shown in Fig. 2.



Fig. 4 a, b, and c, Near E_F SXARPES intensity maps from single crystal diamond (111) films (sample 1, 2, and 3) using 825 eV photon energy along the red curve shown in Fig. 2. d, e, and f, MDCs at E_F , 0.2, 0.4 and 0.6 eV binding energy with an energy window of ± 0.10 eV for sample 1 and 2 and MDCs at E_F , 0.3, 0.6 and 0.9 eV binding energy with an energy window of ± 0.15 eV (dots) for sample 3. A line superimposed on each MDC is a sum of three Lorentzian (green lines) corresponding to the three bands (1, 2, and 3). Please note that very small intensity at E_F for sample 1 as well as intensity at E_F for samples 2 and 3, suggesting a qualitative deference in E_F position.

のL点近傍)でバンド2の底との間にバンドギャップを 示す。これらのバンド分散は、純粋なダイヤモンドバンド に対するバンド計算とよく一致していることがわかった。 試料2のバンド分散は試料1とよく似ており,ドー プによりバンド構造が変化しないことを示す。

次ぎに E_F 近傍の電子状態についてそのホウ素濃 度依存性をより詳細に測定した。その結果を Fig. 4a - c に示す。 Fig. 4a には、3本のバンド(1-3)が見 られ、特に1と2からなる双曲線的な分散を示すバ ンドは Γ 点で丸みを帯びた頂点を持つ。ホウ素濃度 が増えるにしたがって、双曲線的なバンドの頂点の 強度が減少するとともに先端が削られ、Fig. 4c では 先端が平らになっている。

E_F近傍のバンドが分散を運動量分布曲線(MDC Momentum distribution curve) を解析することによ り調べた。MDC は一定の結合エネルギーにおける 光電子強度の運動量依存性を示している。試料3に 関しては, *E*_F および0.3, 0.6, 0.9 eV における MDC を示している (Fig. 4f)。図から分かるように MDC は複数の構造をもち、バンド1-3に対応した3本の ローレンツ関数で再現できることが分かる。(バン ド5は強度が小さいために考慮していない) $E_{\rm F}$ での MDC も3つのローレンツ関数で再現できることが わかる。このことは、ダイヤモンドバンドがフェル ミ準位を横切り, Γ点でホールポケットを持つこと を示す。加えて、3本のローレンツ関数の中心の運 動量の値としてフェルミ運動量 kr を求めることがで きる $(k_{\rm F}^1 = -0.15 \pm 0.04 \text{ Å}^{-1}, k_{\rm F}^2 = 0.11 \pm 0.02 \text{ Å}^{-1},$ $k_{\rm F}^3 = 0.27 \pm 0.02$ Å⁻¹)。ここで求めた $k_{\rm F}$ にバンド計 算を対応させることにより、純粋なダイヤモンドの 価電子帯頂上からの E_Fのエネルギー位置を見積も った。その結果、 $E_{\rm F}$ は価電子帯の頂上より 0.4 ± 0.2 eV 低いエネルギーに位置することが分かった。こ れよりキャリアー濃度を見積もると、6.6×10²⁰ $cm^{-3} < n = 1.9 \times 10^{21} cm^{-3} < 4.4 \times 10^{21} cm^{-3}$ である ことがわかった。

一方, 試料2に対しても同様の解析を行い, $k_{\rm F} \epsilon$ 求めた ($k_{\rm F}^{1} = -0.09 \pm 0.01$ Å⁻¹, $k_{\rm F}^{2} = 0.06 \pm 0.008$ Å⁻¹, $k_{\rm F}^{3} = 0.19 \pm 0.007$ Å⁻¹)。これよりフェルミ準位 の位置が0.2±0.1 eV であることが分かり, キャリ アー数として6×10¹⁹ cm⁻³ < $n = 6.6 \times 10^{20}$ cm⁻³ < 9.8×10^{20} cm⁻³ が見積もられた。光電子分光の結果 から見積もられたキャリアー濃度はホウ素濃度より も少ない。この理由についてはよく分かっていない が,ホウ素原子が格子間位置に入る可能性や,置換 位置に入ったホウ素に水素が結合しキャリアーを補 償する可能性などが議論されている。

以上の結果は、高濃度ホウ素ドープダイヤモンド

においては、ダイヤモンドバンドに導入されたホー ルが金属的伝導に重要な役割を担うことを示しているよう に見える。このことは、バンド計算の結果とは矛盾せずフ ォノンによる超伝導機構を支持している。極最近、バンド 計算から予測されたフォノンのソフトニングが非弾性 X 線散乱実験から観測された¹¹⁾。その一方で、電気抵抗測 定などから極端に短いキャリアー寿命が指摘されており、 強い不純物散乱を考慮した超伝導モデルも提案されてい $る^{12)}$ 。 E_F 近傍のより詳細な電子状態の研究のためには、 より高分解能での測定が必要である。

4. まとめと今後の展望

高濃度ホウ素ドープダイヤモンド超伝導体の電子状態を 軟X線角度分解光電子分光により観測し,ダイヤモンド バンドとよく似たバンド分散,およびホウ素ドープ量の増 加に伴いバンドの価電子帯頂上にホールが形成されること を見出した。この結果は,高濃度ホウ素ドープダイヤモン ドの金属性の起源を示すとともに,低温で起こる超伝導の 機構の理解に対して重要な一歩を与える。

その一方で、今回の実験は軟X線角度分解光電子分光 が、新規機能性物質の電子状態を研究する上で重要な研究 手段であることも示す。真空紫外角度分解光電子分光に比 べて分解能という点ではひけをとるが、まだ電子状態自体 のよく分からない新規物質の運動量に分解した電子状態を より高い信頼度で観測できる点は大きな特色である。今 後、仮にも測定分解能250 meVを25 meVにまで引き上げ ることができれば、室温前後に転位点を持つ相転移現象に 関してはその電子状態変化まで測定することができ軟X 線角度分解光電子分光の重要性をさらに高めることができ るはずである。今後のビームラインおよび軟X線角度光 電子分光技術のさらなる発展を願ってやまない。

謝辞

この研究は、樹高輝度光科学研究センター(JASRI)の 中村哲也、松下智裕、室隆桂之各研究員、物質・材料研究 機構の長尾雅則研究員、高野義彦グループリーダー、早稲 田大学理工学部の竹之内智大氏、川原田洋教授、広島大学 の小口多美夫教授各氏との共同研究の成果である。また、 有益な議論をして頂いた理研のチャイナニアシシ先任研究 員、マシンタイムの調整をして頂いた JASRI の木下豊彦 グループリーダーに感謝します。

参考文献

- N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics. Saunders College Publishing, Fortworth, 1976.
- N. Mott: Metal-insulator transitions. Taylar & Francis, London, 1990.
- 3) E. A. Ekimov et al.: Nature 428, 542 (2004).
- 4) Y. Takano et al.: Appl. Phys. Lett. 85, 2851 (2004).
- E. Bustarret, F. Gheeraert and K. Watanabe: *Phys. Rev. Lett.* 93, 237005 (2004).
- A. T. Collins and A. W. S. Williams: J. Phys. C: Solid St. Phys. 4, 1789 (1971).
- 7) G. Baskaran: cond-mat/0404286.
- L. Boeri, J. Kortus and O. K Andersen: Three-dimensional MgB₂-Type superconductivity in hole-doped diamond. *Phys. Rev. Lett.* 93, 237002 (2004); K.-W. Lee and W. E. Pickett: Superconductivity in boron-doped diamond. *Phys. Rev. Lett.* 93, 237003 (2004); X. Blase, Ch. Adessi and D. Connetable: Role of the dopant in the superconductivity of diamond. *Phys. Rev. Lett.* 93, 237004 (2004); H. J. Xiang, Z. Ii, J. Yamg, J. G. Hou and Q. Zhu: *Phys. Rev.* B 70, 212504 (2004).
- 9) H. Umezawa *et al.*: cond-mat/0503303.
- 10) T. Matsushita et al.: Surface Review and Letters 9, 1321 (2002); M. Kamakura et al.: Europhys. Lett. 67, 240 (2004);
 A. Sekiyama et al.: Phys. Rev. B 70, 060506 (R) (2004); S. Souma et al.: Phys. Rev. B 70, 073104 (2004).
- 11) M. Hoesch et al.: cond-mat/0512424.
- 12) H. Fukuyama: Meething Abstracts of the Physical Society of Japan 61, Issue 1, Part 3, page 591.



● 著 者 紹 介 ●

横谷尚睦

岡山大学大学院自然科学研究科・教授 E-mail: yokoya@cc.okayama-u.ac.jp 専門:固体物理,光電子分光による機能 性物質の電子状態研究 [略歴]

1997年3月,東北大学大学院理学研究 科物理学専攻博士課程修了。1997年4 月,日本学術振興会特別研究員(PD)。 1998年10月,東京大学物性研究所助手。 2004年4月,財団法人高輝度光科学研 究センター軟X線チームリーダー・主 幹研究員。2005年4月,現職。

Soft X-ray angle-resolved photoemission spectroscopy of highly boron-doped diamond superconducting films

Takayoshi YOKOYAThe Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University,
3-1-1 Tsushima-naka, Okayama 700–8530 Japan

Abstract The electronic structure of heavily boron doped dimaond superconducing filmes with diferent boron concentrations were measured with soft X-ray angle-resolved photoemission spectroscopy (SXARPES). SXARPES results clearly show valence band dispersions with a bandwidth of ~ 23 eV and with a top of the valence band at Γ in the Brillouin zone, which are consistent with the calculated valence band dispersions of pure diamond. Boron concentration dependent band dispersions near the Fermi level (E_F) exhibit a systematic shift of E_F , indicating depopulation of electrons due to hole doping. These SXARPES results indicate that diamond bands retain for heavily boron doping and holes in the diamond band are responsible for the metallic states leading to superconductivity at low temperature.